

## Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 18.11.2011 faxen an  
(030) 63 92 – 65 01



Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_

Firma/Einrichtung \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Spätmeldung Poster  ja  nein

Titel des Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der  
Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

### Teilnahmegebühren

170,00 €, Studenten 20,00 €

Überweisung an: IAP e. V.

Konto-Nr. 102 000 5920, Deutsche Kreditbank AG Berlin, BLZ 120 300 00

### Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m<sup>2</sup>  6 m<sup>2</sup>  8 m<sup>2</sup>

Miete 125,00 €/m<sup>2</sup>

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

### Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 63,00 € für ein EZ bzw. 74,00 € für ein DZ  
plus 12,00 € Frühstück

EZ  DZ vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift

### Veranstalter

IAP Institut für angewandte  
Photonik e.V., Berlin  
IfG – Institute for Scientific  
Instruments GmbH, Berlin  
Bundesanstalt für Materialforschung  
und -prüfung, Berlin  
Bruker Nano GmbH, Berlin  
Fraunhofer Institut für Elektronische  
Nanosysteme (ENAS), Chemnitz  
Optec Berlin-Brandenburg e.V.  
Physikalisch-Technische Bundes-  
anstalt, Braunschweig und Berlin  
SPECTRO Analytical Instruments  
GmbH, Kleve  
Technische Universität Berlin  
TSB – Technologiestiftung, Berlin  
VDI/VDE – Gesellschaft Mess-  
und Automatisierungstechnik (GMA)  
VDI-Bezirksgruppe Adlershof  
WISTA-MANAGEMENT GMBH

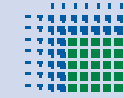
### Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)  
Tel.: (030) 63 92 – 65 09  
Frau D. Zimani (Sekretariat IAP e. V.  
und IfG GmbH)  
Tel.: (030) 63 92 – 65 00  
IAP Institut für angewandte  
Photonik e.V.  
Rudower Chaussee 29/31, 12489 Berlin  
Fax: (030) 63 92 – 65 01  
E-Mail: [info@ifg-adlershof.de](mailto:info@ifg-adlershof.de)

### Programmkomitee

E. Auerswald, ENAS, Chemnitz  
B. Beckhoff, PTB, Berlin  
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin  
F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe  
W. Daum, BAM, Berlin  
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,  
Duisburg  
A. Janßen, FH Münster  
B. Kanngießner, TU Berlin  
M. Krumrey, PTB, Berlin  
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin  
A. Kharchenko, PANalytical,  
Almelo, Niederlande  
M. Maiwald, BAM, Berlin  
H. Miersch, Spectro Analytical  
Instruments GmbH, Kleve  
M. Ostermann, BAM  
U. Panne, BAM und  
Humboldt-Universität, Berlin  
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative  
Technologies  
W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin  
Th. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin  
R. Wedell, IAP, Berlin  
J. Wiesmann, Incoatec GmbH,  
Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter  
[www.adlershof.de](http://www.adlershof.de)



# PRORA 2011

## Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

24. und 25. November 2011

im WISTA – Wissenschafts-  
und Technologiepark Adlershof  
Einstein-/Newton-Kabinett  
Bunsensaal  
Rudower Chaussee 17  
12489 Berlin



## PROGRAMM

### DONNERSTAG, 24.11.2011

- 10.00 – 10.20 Eröffnung  
*H. Schmitz (WISTA MANAGEMENT GMBH)*  
*B. Weidner (OptecBB)*  
*R. Wedell (IAP e.V.)*
- 10.20 – 12.30 **Methodische Probleme der Prozessanalytik**  
*Leitung: R. Wedell*
- 10.20 – 10.50 *U. Panne (HU Berlin und BAM) (E)*  
Hyphenated Spectroscopy – Prospects for XRF?
- 10.50 – 11.10 *J. Piltz (amtec Analysenmesstechnik GmbH)*  
Die Verfügbarkeit von Inline-Messsystemen
- 11.10 – 11.30 *J. Simon (Thermo Fisher Scientific GmbH)*  
Vielfältige Möglichkeiten der Mikroanalytik am SEM und der Oberflächenanalytik mittels XPS
- 11.30 – 11.50 *V. Rößiger (Helmut Fischer GmbH)*  
Referenznormale für die RFA
- 11.50 – 12.10 *F. Eggert (EDAX / Ametek)*  
Spektrenauswertung unter Berücksichtigung des Pile-Up Effektes bei SDD Spektrometern und hohen Impulsraten
- 12.10 – 12.30 *M. Haschke u.a. (Bruker Nano GmbH)*  
Energieauflösung vs. Zählraten – was ist der optimale Kompromiss?
- 12.30 – 13.30 Mittagspause
- 13.30 – 15.00 **Applikationen in der Industrie**  
*Leitung: B. Beckhoff*
- 13.30 – 14.00 *Ch. Zarkadas (PANalytical B. V.) (E)*  
X-Ray Fluorescence Analysis for Industrial Applications
- 14.00 – 14.20 *D. Mucke u.a. (GEOMONTAN Gesellschaft für Geologie und Bergbau mbH & Co. KG)*  
Erfahrungen mit SPECTRO xSORT bei der modernen Erkundung einer Kupferlagerstätte im Zechstein
- 14.20 – 14.40 *N. Kessler (Thermo Fisher Scientific GmbH)*  
Neue Möglichkeiten in der Röntgenanalytik durch Mapping und Spotting mit dem Thermo ARL Perform X
- 14.40 – 15.00 *S. van den Bosch (ThyssenKrupp Steel Europe AG)*  
Kombination der XRF mit anderen Analyseverfahren
- 15.00 – 15.30 Kaffeepause
- 15.30 – 17.40 **Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte**  
*Leitung: Th. Schülein*

- 15.30 – 15.50 *A. Erko et al. (HZB für Materialien und Energie / BESSY)*  
Novel Wavelength-Dispersive Parallel X-Ray Spectrometer
- 15.50 – 16.10 *S. Bjeoumikhova u.a. (IfG GmbH)*  
Röntgenkapillarroptiken für verschiedene analytische Anwendungen – erreichter Entwicklungsstand
- 16.10 – 16.40 *L. Vincze et al. (University of Ghent, Belgium) (E)*  
Applications of Full Field Micro-XRF Analysis using a Prototype X-Ray Colour Camera
- 16.40 – 17.00 *A. Kühn u.a. (BAM, IAP e.V., PNSensor, HU Berlin)*  
Schnelle orts aufgelöste Messung der Elementverteilung in TXRF – Proben
- 17.00 – 17.20 *J. Wiesmann et al. (Incoatex GmbH)*  
High Brilliance Microfocus Sources for X-Ray Diffractometry
- 17.20 – 17.40 *M. Krämer et al. (AXO Dresden GmbH)*  
XRF Reference Samples for Applications in Synchrotron and Laboratory Instrumentation
- 18.00 – 19.30 **Postersession und Rundgang**  
durch die Firmenausstellung  
*Eröffnung: E. Auerswald*
- 19.30 Gemeinsames Abendessen

### FREITAG, 25.11.2011

- 9.00 – 10.30 **Applikationen in der Industrie**  
*Leitung: H. Miersch*
- 9.00 – 9.30 *A. Nutsch (Fraunhofer Institut IISB) (E)*  
Röntgenanalytik zur Charakterisierung von Oberflächenkontaminationen und dünnen Filmen auf Halbleitersubstraten
- 9.30 – 09.50 *T. Trobitzsch-Ryll u.a. (IfG GmbH)*  
Prozessnahe Röntgenanalytik an Dünnschichtsystemen mit IfG Messköpfen ELBRUS
- 9.50 – 10.10 *H. Borrmann u.a. (MPI für Chemische Physik fester Stoffe)*  
Harte Röntgenstrahlung in der (Pulver-)Diffraktometrie
- 10.10 – 10.30 *T. Salge et al. (Bruker Nano GmbH, BAM, Anadolu University / Türkei)*  
Advanced Light Element and Low Energy X-Ray Analysis of Ceramics and Ceramic-Metal Joints using SEM/EDX with Silicon Drift Detectors (SDD)
- 10.30 – 11.00 Kaffeepause
- 11.00 – 12.30 *Leitung: M. Ostermann*
- 11.00 – 11.30 *A. Braun (Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) (E)*  
Application of X-Ray and Electron Spectroscopy to Energy Materials

- 11.30 – 11.50 *M. Müller u.a. (PTB)*  
Röntgenspektrometrie für die Entwicklung neuer Materialien für die Energieerzeugung und Speicherung
- 11.50 – 12.10 *A. Zierau u.a. (L.U.M. GmbH und IAP e. V.)*  
Untersuchung zur Volumenkonzentrationsauflösung ausgewählter Suspensionen mittels monoenergetischer Röntgentransmission
- 12.10 – 12.30 *H. Miersch u.a. (Spectro Analytical Instruments GmbH)*  
Der Weg des Lichts & der Weg der Daten
- 12.30 – 13.30 Mittagspause
- 13.30 – 15.40 **Neue röntgenanalytische Methoden**  
(Forschungsvorlauf)  
*Leitung: N. Langhoff*
- 13.30 – 14.00 *I. Mantouvalou u.a. (TU Berlin / BLiX, Max-Born-Institut) (E)*  
Laserplasmaquellen für angewandte Röntgenspektroskopie im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung
- 14.00 – 14.20 *R. Unterumsberger u.a. (PTB)*  
Vergleich von quantitativer Röntgenfluoreszenzanalyse an vergrabenen Nanoschichten in konventioneller Geometrie und unter streifendem Einfall
- 14.20 – 14.40 *B. Pollakowski u.a. (PTB)*  
Zerstörungsfreie chemische Speziation von tief vergrabenen Nanostrukturen mithilfe von GIXRF-NEXAFS
- 14.40 – 15.00 *E. Zschech (Fraunhofer IZFP Dresden)*  
Anwendung der Röntgenmikroskopie zur Prozessentwicklung bei der 3D IC-Integration
- 15.00 – 15.20 *J. Wernecke u.a. (PTB)*  
Charakterisierung von Nanostrukturen auf Oberflächen mittels Röntgenkleinwinkelstreuung unter streifendem Einfall (GISAXS)
- 15.20 – 15.40 Schlusswort

Im Vorfeld der Fachtagung PRORA findet zum zweiten Mal das Satellite-Meeting des „Berlin Laboratory for innovative X-Ray Technologies“, BLiX, an der TU Berlin statt. In dieser Veranstaltung werden laufende Arbeiten des BLiX und der Arbeitsgruppe „Analytische Röntgenphysik“ vorgestellt.

Ort: TU Berlin, Hardenbergstr. 26, Raum EW 049/050  
Zeit: Mittwoch, 23.11.2011, 14.00 – 16.00 Uhr

Anmeldungen für das Satellite-Meeting können mit der Anmeldung zur PRORA erfolgen.